연세대학교 글로벌융합기술원
YONSEI INSTITUTE OF CONVERGENCE TECHNOLOGY

제 1회 첨단분석 워크숍

(전자 현미경 분야)

오시는 길

주소 : 인천광역시 연수구 송도과학로 85 연세대학교
국제캠퍼스 자유관 A 521호

※ 교통편 안내 ※

1. 대중교통
   · 서울방면
   M6405, M6724 승차 → 연세대 송도캠퍼스입구 하차

   · 그 외 지역 :
   인천종합터미널 하차 → 인천지하철 캠퍼스타운 역 하차
   → 도보 10분

2. 지하철
   – 인천지하철 캠퍼스타운 역 2번 출구 하차 도보 10분

연세대학교 글로벌융합기술원 첨단분석센터
YONSEI INSTITUTE OF CONCERGENCE TECHNOLOGY ADVANCED CHARATERIZATION CENTER

한국현미경학회
Korean Society of Microscopy

인 사 말

글로벌융합기술원 첨단분석센터는 2013년 5월에 개소해 STEM, FIB, FE-SEM, TOF-SIMS, XPS 등 총 20여 종류의 연구 장비가 다양한 연구분야에 활용되고 있습니다.

효과적인 분석서비스와 다양한 정보 제공을 위하여 "제 1회 첨단분석워크숍-전자현미경분야"를 개최하게 되었습니다.

이번 워크숍은 글로벌융합기술원과 한국현미경학회에서 공동으로 개최하며, 구면수차보정 투과전자현미경 (Cs-corrected STEM), 다중집속이온빔장치 (FIB), 주사전자현미경 (FE-SEM)에 대한 강의로 구성되었습니다. 전자현미경에 대한 기초 부터 응용에 이르기까지 다양한 강의가 소개될 예정이니, 많은 관심과 참여 부탁 드립니다.

연세대학교 글로벌융합기술원 첨단분석센터
YONSEI INSTITUTE OF CONCERGENCE TECHNOLOGY ADVANCED CHARATERIZATION CENTER

일 시 2015년 5월 8일 금요일

장 소 연세대학교 국제캠퍼스 자유관 A 521호

대 상 산업체, 연구소 연구원, 대학원생

인 원 50명 내외 (선착순)

참가비 일반 (산업체, 연구소 연구원 등) 8만원, 학교 (대학원생) 5만원

결 제
- 입금 계좌 : KB국민은행 461301-04-074377, (사)한국현미경학회
- 카드 결제 가능 (단, BC카드만 사전 결제 가능)

문의 및 참가신청 첨부된 참가신청서를 작성하여 메일로 송부
문진영 (032-749-5821, moonjy@yonsei.ac.kr)

접수 기간 2015년 4월 17일 ~ 5월 1일

워크숍 프로그램

강의시간	강의내용	강 사	소 속	장 소
09:20 ~ 09:50	등 록			자유관 A 521호
09:50 ~ 10:00	인사말 (첨단분석센터장 : 여종석)			
10:00 ~ 11:30	SEM & e-beam lithography의 기초와 활용	장준연 박사	KIST	
11:30 ~ 13:00	점 심 식 사			
13:00 ~ 14:30	TEM의 기초와 활용	양철웅 교수	성균관대학교	자유관 A 521호
14:30 ~ 14:45	Coffee break			
14:45 ~ 16:15	FIB의 기초와 활용	안재평 박사	KIST	
16:15 ~ 17:30	첨단분석센터 Tour			첨단분석센터